05.2;06.5

Адгезия на границе раздела Ta(Mo)/NiTi

© А.В. Бакулин^{1,2}, С.Е. Кулькова^{1,2}

¹ Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия ² Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия E-mail: bakulin@ispms.tsc.ru

Поступило в Редакцию 28 февраля 2019 г. В окончательной редакции 27 марта 2019 г. Принято к публикации 27 марта 2019 г.

Методом проекционных присоединенных волн в рамках теории функционала электронной плотности изучена атомная и электронная структура границ раздела Me(110)/NiTi(110) и $\text{TiO}_2(100)/Me(110)$, где Me = Ta, Мо. Показано, что формирование на границе раздела металл—сплав промежуточных оксидных слоев может приводить к понижению адгезии на интерфейсе.

Ключевые слова: NiTi, граница раздела, адгезия.

DOI: 10.21883/PJTF.2019.12.47917.17661

Известно, что интерметаллические сплавы на основе NiTi обладают уникальными механическими свойствами, в том числе эффектом памяти формы и сверхпластичностью. В связи с этим они нашли практическое применение в различных отраслях современной индустрии. Штифты, различные фиксаторы, дентальные и костные импланты из никелида титана широко используются в медицине. Взаимодействие между материалом, из которого изготовлен имплант, и человеческими клетками является основной проблемой для медицинских приложений. Считается, что биосовместимость NiTi с человеческими клетками — результат образования тонкой инертной пленки TiO₂ на его поверхности, которая препятствует выходу никеля [1]. Авторы [2] на основе экспериментальных исследований проволок из NiTi с оксидными слоями разной толщины и термодинамического анализа сделали вывод, что выход Ni на поверхность сплава может быть предотвращен, если она полностью окисляется. Известно, что титан при взаимодействии с кислородом может образовывать на поверхности NiTi шкалу оксидов титана (Ti₂O, TiO, Ti₂O₃, Ti₃O₅, TiO₂), которая зависит от способов обработки поверхности [1]. Поскольку наличие токсичного элемента Ni в сплаве ограничивает его медицинское применение, улучшение биосовместимости и коррозионной стойкости NiTi является важной задачей современного материаловедения [3]. Это может быть достигнуто модификацией поверхности сплава, поскольку только она или несколько поверхностных слоев находятся в контакте с человеческими клетками. Для модификации поверхности используются магнетронное напыление и ионная имплантация биотолерантных химических элементов, которые могут формировать тонкие покрытия на поверхности NiTi [4,5]. К таким покрытиям также предъявляются определенные требования, прежде всего они не должны быть агрессивными по отношению к биотканям. В связи с этим при формировании тонких покрытий на поверхности NiTi одной из актуальных проблем является адгезионная прочность. В работах [4,5] в качестве покрытий использовались тантал и молибден, которые наносились путем магнетронного распыления на поверхность NiTi. При этом предварительно поверхностный слой убирался посредством механической шлифовки, а затем электролитической обработки, детали которой приведены в [4,5]. Авторы работ [4,5] обнаружили частичное или полное отслоение металлических покрытий, при этом образцы с покрытиями молибдена были более стойкими.

Вопросы, связанные с изучением адгезионных свойств металлических покрытий на поверхности NiTi, практически не исследовались теоретическими методами. В ряде работ [6–8] методами из первых принципов (*ab initio*) изучалась адсорбция атомного и молекулярного кислорода на поверхности NiTi(110), а также атомная структура границы раздела TiO₂(100)/NiTi(110). Поэтому целью настоящей работы является сравнительное изучение атомной структуры и адгезионных свойств пленок Та и Мо на стехиометрической поверхности NiTi(110). Чтобы объяснить имеющиеся экспериментальные факты, отмеченные в работах [4,5], были также рассмотрены границы раздела TiO₂(100)/*Me*(110) и проведено сопоставление с результатами, полученными ранее для интерфейса TiO₂(100)/NiTi(110).

Металлы групп VB и VIB имеют объемно центрированную структуру (ОЦК) и параметры решетки, близкие к таковым для B2-TiNi, поэтому их пленки могут формироваться на поверхности сплава (рис. 1, *a*). Работа отрыва (W_{sep}), или идеальная энергия адгезии, является фундаментальной величиной, определяющей прочность границ раздела. Напомним, что W_{sep} — это работа, которая затрачивается на разделение интерфейса на две свободные поверхности. Согласно уравнению Дюпре

$$W_{sep} = \sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_{12}, \tag{1}$$

она равна разности между суммой поверхностных энергий (σ_i) контактирующих материалов и интерфейсной



Рис. 1. Атомная структура идеальной границы раздела Me(110)/NiTi(110) (*a*) и локальные ПЭС интерфейсных атомов (*b*, *c*). Символы *I* и *I* ± 1 обозначают интерфейсный и второй от интерфейса слои.

Таблица 1. Работа отрыва и интерфейсное расстояние (*d*) на границе раздела *Me*/NiTi(110)

Интерфейс (110)	$W_{sep}, J/m^2$	<i>d</i> , Å
Ta/NiTi	4.04	2.19-2.48
Mo/NiTi	4.31	2.10-2.38

энергией (σ_{12}) [9]. Поскольку экспериментально работу отрыва трудно измерить, для ее оценки используется следующая формула:

$$W_{sep} = \sigma_1 (1 + \cos \theta), \tag{2}$$

где θ — контактный угол, который может быть измерен в эксперименте.

Для теоретических оценок более удобной, как показано в [9], является формула

$$W_{sep} = (E_{Me} + E_{\text{NiTi}} - E_{Me/\text{NiTi}})/S, \qquad (3)$$

где $E_{Me/NiTi}$ — полная энергия суперъячейки, содержащей пленки металла и сплава, E_{Me} и E_{NiTi} — полные энергии той же ячейки, но содержащей пленки металла или сплава, а S — площадь границы раздела. Расчет полных энергий проводился методом проекционных присоединенных волн (PAW) в плосковолновом базисе [10]. Для моделирования границ раздела Me(110)/NiTi(110) и $Me(110)/TiO_2(100)$ использовался подход тонких пленок, разделенных промежутком вакуума не менее 15 Å. В случае Me(110)/NiTi(110) четырехслойные пленки

металла рассматривались на обеих поверхностях пленки сплава, которая содержала семь атомных слоев. Положения атомов трех внутренних слоев фиксировались в позициях, соответствующих объемным, а атомы остальных слоев могли смещаться в трех направлениях. Релаксация атомной структуры границ раздела проводилась до достижения сил на атомах $\sim 0.01 \, {\rm eV/A}$. В случае границы раздела $Me(110)/\text{TiO}_2(100)$ металлическая пленка содержала восемь слоев, а пленка оксида — 17-19 атомных слоев в зависимости от его окончания. В этом случае вычислительная ячейка содержала лишь один интерфейс. Работа отрыва, когда пленка металла продолжает структуру сплава на интерфейсе Me(110)/NiTi(110), является максимальной. Как видно из табл. 1, Wsep на границе раздела с молибденом незначительно больше, чем на границе раздела с танталом, что согласуется с экспериментальными данными [4,5]. В настоящее время найдены лишь некоторые интерфейсы, демонстрирующие хорошие адгезионные свойства. В частности, металлы групп VB и VIB обнаруживают высокую адгезию $(9.4-10.3 \text{ J/m}^2)$ на поверхности $Al_2O_3(0001)$ с кислородным окончанием [11]. Адгезия на интерфейсах сплав-металл значительно ниже: $\sim 4 - 6 \, \text{J/m}^2$ в зависимости от их ориентации и конфигурации [12-16]. Из табл. 1 видно, что большее значение Wsep коррелирует с меньшим интерфейсным расстоянием (d). На чистой поверхности NiTi(110) атомы никеля поверхностного слоя находятся ниже атомов титана на 0.33 А. На интерфейсе небольшое расщепление в слое остается, несмотря на восстановление координации атомов сплава, поэтому в табл. 1 приведены минимальное и



Рис. 2. Атомная структура идеальной границы раздела $Me(110)/\text{TiO}_2(100)$ и положение плоскости разрыва для окончаний оксида разными атомными слоями: двумя атомными слоями кислорода (*a*), одним атомным слоем кислорода (*b*), атомным слоем титана (*c*).

максимальное значения *d*. Отметим, что рост пленки молибдена вызывает меньшее напряжение в интерфейсных слоях из-за лучшего согласия параметров решеток.

Плотности электронных состояний (ПЭС) атомов двух слоев от интерфейса представлены на рис. 1, *b*, *c*. Видно, что появление дополнительного электрона на *d*-оболочке Мо приводит к повышению ПЭС и более сильной гибридизации его *s*, *d*-орбиталей с состояниями интерфейсных атомов Ті и Ni, чем в случае Та, что и определяет повышение W_{sep} . Из рис. 1, *b*, *c* видно, что ПЭС атомов сплава второго от интерфейса слоя (I-1) имеют подобный вид, что свидетельствует об их несущественном влиянии на химическую связь на интерфейсе.

Атомная структура интерфейса NiTi(110)/TiO₂(100) обсуждалась ранее в работе [8]. Структурные параметры $TiO_2(100)$ поверхности (a = 4.61 Å и b = 2.96 Å) хорошо согласуются с параметрами поверхности B2-NiTi(110) (4.26 и 3.01 Å). Поверхность $TiO_2(100)$ может иметь три возможных окончания (оканчиваться атомным слоем титана, одним или двумя атомными слоями кислорода). Хотя поверхность TiO₂(100)₀ является стабильной согласно расчетам поверхностной энергии, наименьшая интерфейсная энергия получена для границы раздела с двумя атомными слоями кислорода NiTi(110)/TiO₂(100)₂₀. В этом случае работа отрыва равна 10.30 J/m², однако она существенно понижается на интерфейсе с одним атомным слоем кислорода (1.99-2.25 J/m² в зависимости от его конфигурации). Такое резкое понижение Wsep в зависимости от окончания оксида имеет место и на границе раздела Nb/Al₂O₃(1120) [17,18]. Высокая адгезия на границе раздела NiTi(110)/TiO₂(100)₂₀ объясняется сильной гибридизацией s, d-орбиталей Ni и Ti с 2pсостояниями О, а также переносом заряда от атомов Ті в сплаве к кислороду (0.56е). Уменьшение работы отрыва на границе раздела NiTi(110)/TiO₂(100)_О обусловлено существенным понижением числа связей на интерфейсе, как и в случае Nb(110)/Al₂O₃(1120)_O [17,18]. Как видно из табл. 2, энергия отрыва также максимальна на интерфейсе $Me(110)/\text{TiO}_2(100)_{20}$ (рис. 2, *a*), но существенно понижается на двух других границах раздела (рис. 2, b, c). При этом увеличение работы отрыва на интерфейсе с танталом коррелирует с увеличением ионного вклада в химическую связь, поскольку электроотрицательность тантала на 0.66 меньше, чем для молибдена, т.е. он легче отдает электроны при взаимодействии с кислородом. Небольшое увеличение работы отрыва на интерфейсе $Mo(110)/TiO_2(100)_{Ti}$ (рис. 2, c), когда оксид оканчивается атомным слоем титана, по сравнению с таковой для $Ta(110)/TiO_2(100)_{Ti}$ соответствует тенденции, полученной на интерфейсе Me(110)/NiTi(110). Существенное понижение работы отрыва на интерфейсе $Me(110)/TiO_2(100)_0$ также коррелирует с результатом, полученным для NiTi(110)/TiO $_2(100)_O$. Мы не будем обсуждать поведение локальных ПЭС на упомянутых выше интерфейсах, поскольку тенденции в изменении атомных и электронных свойств металл-оксидных границ раздела неоднократно рассматривались в литературе [7,8,11–18]. В целом в системах с ионно-ковалентным типом химической связи на границах раздела достигается бо́льшая адгезия, чем на границах с металлическим типом связи. Например, работа отрыва изменяется в пределах 9.4-10.6 J/m² [9,11,19-21] на границе раздела

Интерфейс	Та		Мо		NiTi	
	$W_{sep}, J/m^2$	<i>d</i> , Å	$W_{sep}, J/m^2$	<i>d</i> , Å	$W_{sep}, J/m^2$	<i>d</i> , Å
$\begin{array}{c} Me(110)/\text{TiO}_2(100)_{2O} \\ Me(110)/\text{TiO}_2(100)_O \\ Me(110)/\text{TiO}_2(100)_{\text{Ti}} \end{array}$	10.33 2.34 1.73	$1.31 - 1.38 \\ 1.40 - 1.57 \\ 2.60 - 2.63$	8.47 1.66 1.97	$1.26 - 1.33 \\ 1.32 - 1.58 \\ 2.43 - 2.45$	10.30 1.99–2.25 –	0.82-1.56 1.19-1.88 -

Таблица 2. Работа отрыва и интерфейсное расстояние на границе раздела Me/TiO₂(100)

 $Me/Al_2O_3(0001)_O$, где Me — металлы с ОЦК-структурой (Nb, Ta, Mo, W). Меньшие значения достигаются на границах раздела с ГЦК-металлами, для которых разброс в W_{sep} значительно шире: значения $3.93-4.70 \text{ J/m}^2$ были получены для Ag/Al₂O₃(0001)_O [22–24], $5.62-5.94 \text{ J/m}^2$ для Cu/Al₂O₃(0001)_O [22,25,26] и $8.67-10.1 \text{ J/m}^2$ для Al/Al₂O₃(0001)_O [25]. В то же время значения работы отрыва на границе раздела $Me/Al_2O_3(0001)_{Al}$ значительно ниже: например, в случае меди W_{sep} равна 1.02 J/m^2 [25]. Значения $1.08-1.36 \text{ J/m}^2$ были получены для алюминия [25,27] и $2.4-2.8 \text{ J/m}^2$ для ниобия [19–21]. Подобные тенденции наблюдаются на границах раздела с другими металлическими оксидами [28,29].

Хотя теоретические значения энергии адгезии на границе раздела Ta(Mo)/NiTi(110)достигают $4.04-4.31 \text{ J/m}^2$, одной из причин отшелушивания металлических пленок от поверхности сплава, наблюдаемого в эксперименте [4,5], может быть тот факт, что кислород остается в приповерхностной области. Последнее приводит к формированию оксидов титана вследствие высокой реактивности титана [8]. Адгезия на границах раздела металл(сплав)-оксид достаточно высокая, но она имеет существенно более низкое значение, если плоскость разрыва проходит между двумя атомами кислорода в оксиде, как показано на рис. 2, а. Значения 1.23-2.46 и 1.40 J/m² были получены для $Me/TiO_2(100)_{2O}$ и NiTi/TiO₂(100)_{2O} соответственно. Таким образом, формирование промежуточных оксидных слоев на интерфейсе Me/NiTi(110) может иметь негативный эффект с точки зрения адгезионных свойств металлических пленок на поверхности сплава NiTi.

Благодарности

Численные расчеты выполнены на суперкомпьютере SKIF-Cyberia в Томском государственном университете.

Финансирование работы

Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№ 18-03-00064_а), а также в рамках проекта III.23.2.8 ИФПМ СО РАН и программы повышения конкурентоспособности ТГУ.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Shabalovskaya S.A., Anderegg J., Van Humbeeck J. // Acta Biomater. 2008. V. 4. P. 447–467. DOI: 10.1016/j.actbio.2008.01.013
- [2] Tian H., Schryvers D., Liu D., Jiang Q., Van Humbeeck J. // Acta Biomater. 2011. V. 7. P. 892–899.
 DOI: 10.1016/j.actbio.2010.09.009
- [3] Wataha J.C. // J. Prosthetic Dentistry. 2000. V. 83. P. 223–234. DOI: 10.1016/S0022-3913(00)80016-5
- [4] Лотков А.И., Мейснер Л.Л., Сергеев В.П., Прозорова Г.В., Нейман А.А., Дементьева М.Г. // Деформация и разрушение материалов. 2009. № 5. С. 26–31.
- [5] Мейснер Л.Л., Лотков А.И., Нейман А.А., Мейснер С.Н., Дементьева М.Г., Прозорова Г.В. // Материаловедение. 2009. № 12. С. 29–40.
- [6] Nolan M., Tofail S.A.M. // Biomaterials. 2010. V. 31. P. 3439– 3448. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2010.01.060
- [7] Nolan M., Tofail S.A.M. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2010.
 V. 12. P. 9742–9750. DOI: 10.1039/c002562c
- [8] Kulkova S.E., Bakulin A.V., Hu Q.M., Yang R. // Physica B. 2013. V. 426. P. 118–126. DOI: 10.1016/j.physb.2013.06.025
- [9] Finnis M.W. // J. Phys.: Condens. Matter. 1996. V. 8. P. 5811– 5836.
- Blöchl P.E. // Phys. Rev. B. 1994. V. 50. P. 17953–17979.
 DOI: 10.1103/PhysRevB.50.17953
- [11] Мельников В.В., Кулькова С.Е. // ЖЭТФ. 2012. Т. 141. В. 2. С. 345–354.
- [12] Liu W., Li J.C., Zheng W.T., Jiang Q. // Phys. Rev. B. 2006.
 V. 73. P. 205421. DOI: 10.1103/PhysRevB.73.205421
- [13] Shang J.X., Guan K., Wang F.H. // J. Phys.: Condens. Matter. 2010. V. 22. P. 085004. DOI: 10.1088/0953-8984/22/8/085004
- [14] Li J., Yang Y.Q., Luo X. // Comput. Mater. Sci. 2012. V. 62.
 P. 136–141. DOI: 10.1016/j.commatsci.2012.05.013
- [15] Li J., Zhang M., Zhou Y., Chen G. // Appl. Surf. Sci. 2014.
 V. 307. P. 593–600. DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.04.079
- [16] Linghu Y., Wu X., Wang R., Li W., Liu Q. // Crystals. 2016.
 V. 6. P. 32. DOI: 10.3390/cryst6040032
- [17] Мельников В.В., Еремеев С.В., Кулькова С.Е. // ЖТФ. 2011. Т. 81. В. 10. С. 114–121.
- [18] Du J.L., Fang Y., Fu E.G., Ding X., Yu K.Y., Wang Y.G., Wang Y.Q., Baldwin J.K., Wang P.P., Bai Q. // Sci. Rep. 2016. V. 6. P. 33931. DOI: 10.1038/srep33931
- Batirev I.G., Alavi A., Finnis M., Deutsch T. // Phys. Rev. Lett. 1999. V. 82. P. 1510–1513.
 DOI: 10.1103/PhysRevLett.82.1510

- [20] Zhang W., Smith J.R. // Phys. Rev. B. 2000. V. 61. P. 16883.
 DOI: 10.1103/PhysRevB.61.16883
- [21] Еремеев С.В., Немирович-Данченко Л.Ю., Кулькова С.Е. // ФТТ. 2008. Т. 50. В. 3. С. 523–532.
- [22] Кулькова С.Е., Еремеев С.В., Hocker S., Schmauder S. // ФТТ. 2010. Т. 52. В. 12. С. 2421–2427.
- [23] Feng J., Zhang W., Jiang W. // Phys. Rev. B. 2005. V. 72.
 P. 115423. DOI: 10.1103/PhysRevB.72.115423
- [24] Zhukovskii Y.F., Kotomin E.A., Herschend B., Hermansson K., Jacobs P.W.M. // Surf. Sci. 2002. V. 513. P. 343. DOI: 10.1016/S0039-6028(02)01778-8
- [25] Batyrev I.G., Kleinman L. // Phys. Rev. B. 2001. V. 64.
 P. 033410. DOI: 10.1103/PhysRevB.64.033410
- [26] Zhang W., Smith J.R., Evans A.G. // Acta Mater. 2002. V. 50.
 P. 3803–3816. DOI: 10.1016/S1359-6454(02)00177-5
- [27] Zhang W., Smith J.R. // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 85. P. 3225– 3228. DOI: 10.1103/PhysRevLett.85.3225
- [28] Beltrán J.I., Muñoz M.C. // Phys. Rev. B. 2002. V. 78.
 P. 245417. DOI: 10.1103/PhysRevB.78.245417
- [29] Muñoz M.C., Gallego S., Beltrán J.I., Cerdá J. // Surf. Sci. Rep. 2006. V. 61. P. 303. DOI: 10.1016/j.surfrep.2006.03.002